

## 高温用デバイス試験治具①

困っている

### ■ 試験準備に時間がかかり効率が悪い

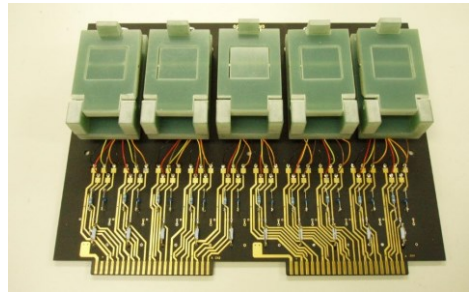
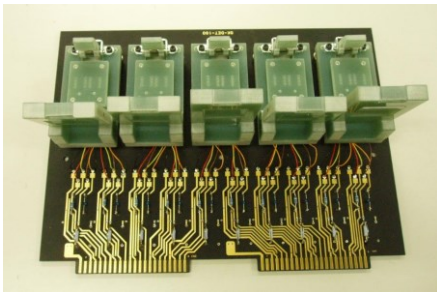
- 恒温槽内の試験毎にハンダ付け、配線作業を行っている  
→簡略出来ないか
- 同時に試験するデバイスが多くなると準備の手間が増える  
→効率良く試験がしたい

### ■ ご提案

試験の配線をパターン化した基板の治具を提案、ワンタッチ取付けの耐熱治具も作り組合わせが可能



ココもポイント 150℃の高温にも対応



### ■ お客様の声

- 試験の準備時間が大幅に削減出来た
- 誰が取付けても同じ環境が作れるのが良い
- パッケージの異なるデバイスもアダプタ交換で対応できた

## 高温用デバイス試験治具②

ご要望の  
ポイント

### ■ 必要な試験が出来ず困っている

- 半導体デバイスの加速寿命試験で取り付けが簡単に出来る治具がほしい。
- 恒温槽内でデバイスが実装された状態でピンに電圧を並列に印可出来ることが条件。

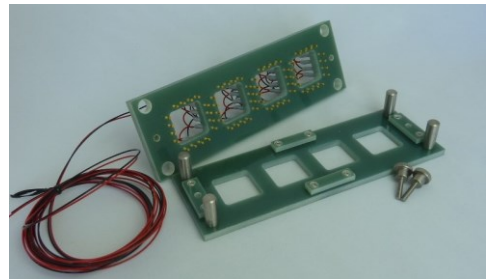
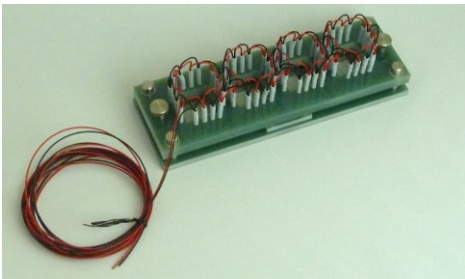
### ■ ご提案

デバイスが実装された基板上のランドにコンタクトプローブを介して電圧が印可出来るような治具を製作



ココも  
ポイント

加速寿命試験の高温・高温環境に耐える材料で製作



### ■ お客様の声

- 大がかりな試験システムを構築しなくても簡単に半導体デバイスの実装状態での試験が出来るので非常にコストパフォーマンスが良い。

# チップコンデンサ用測定治具

## ■ 正確な試験をしたい

困っている

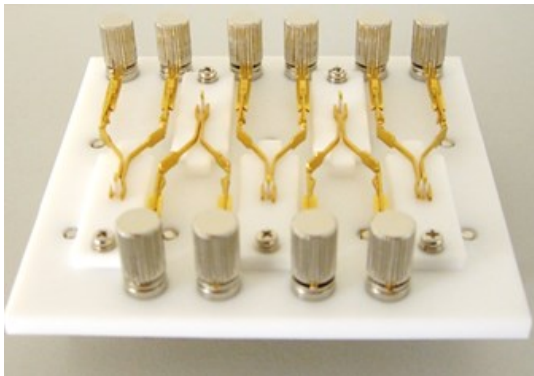
小型のチップコンデンサの試験測定を行うが、既存の専用治具では、コンタクトが正確に行えず現場から改善の要求が度々あった。→ 微少なコンタクトが可能な治具がほしい。

## ■ ご提案

実績のあるコンタクトピンの配置を、今回のチップコンデンサ測定に応用した治具を提案、誰でも簡単に正確なコンタクトが可能となった



ココもポイント お客様自作の専用治具に応用が出来た



## ■ お客様の声

- 試験の作業効率が格段に上がった
- 従来のセット時間 15分/10個 → 20秒程度 に短縮

## 基板圧電測定用治具（ブロック用、基板用）

困っている

### ■ 試験の精度が悪い

自作の治具を使って基板の共振周波数と静電容量を測定しているが、接点の不良が度々起き、正確な試験が出来ない、計測リード線の長さの関係で精度も悪い。

→治具の見直をしたい

### ■ ご提案

測定対象である複数のDUTを調査し、DUTのサイズが違ってても正確な測定が出来るように、コンタクト調整機構を設けた。余分な配線を排しケーブルの影響を少なくした。



ココもポイント DUTのセットとコンタクトが容易



### ■ お客様の声

- 時間の損失が解消、精度も改善され非常に助かっている
- 容易にセットが出来るのが良い